Документ полтисан простой алектронной полтиство НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Информация о владельце:

ФИО: Исаев Игорь Магомедович

Должность: Проректо **Редеральное государственное автономное образовательное учреждение** Дата подписания: 09.07.2023 20:53:26 **высшего образования**

Уникальный про**фрациональный исследовательский технологический университет «МИСИС»** d7a26b9e8ca85e98ec3de2eb454b4659d061f249

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Приемники оптического излучения

Закреплена за подразделением

Кафедра ППЭ и ФПП

Направление подготовки

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Профиль

 Форма обучения
 очная

 Общая трудоемкость
 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108 Формы контроля в семестрах:

в том числе: зачет с оценкой 7

 аудиторные занятия
 51

 самостоятельная работа
 57

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого		
Недель	1	8			
Вид занятий	УП РП		УП	РΠ	
Лекции	17	17	17	17	
Лабораторные	17	17	17	17	
Практические	17	17	17	17	
Итого ауд.	51 51 51 51		51		
Контактная работа	51	51	51 51 51		
Сам. работа	57 57		57	57	
Итого	108	108	108	108	

Программу составил(и):

к.т.н., Ст.преп., Саранин Данила Сергеевич

Рабочая программа

Приемники оптического излучения

Разработана в соответствии с ОС ВО:

Самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» по направлению подготовки 11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА (приказ от 02.04.2015 г. № 95 о.в.)

Составлена на основании учебного плана:

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА, 11.03.04-БЭН-22.plx , утвержденного Ученым советом НИТУ МИСИС в составе соответствующей ОПОП ВО 22.09.2022, протокол № 8-22

Утверждена в составе ОПОП ВО:

11.03.04 ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА, , утвержденной Ученым советом НИТУ МИСИС 22.09.2022, протокол № 8-22

Рабочая программа одобрена на заседании

Кафедра ППЭ и ФПП

Протокол от 17.06.2021 г., №11

Руководитель подразделения Диденко Сергей Иванович

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ

1.1 Цель – формирование знаний и компетенций в области полупроводниковых преобразователей оптического излучния, технологии и сфер применения.

	2. N	ЛЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ					
	Блок ОП:	Б1.В.ДВ.05					
2.1	Требования к предва	рительной подготовке обучающегося:					
2.1.1	Биполярные полупроводниковые приборы						
2.1.2	Квантовая и оптическая электроника						
2.1.3	Материаловедение полупроводников и диэлектриков						
2.1.4	Технология материало	в электронной техники					
2.1.5	Физика диэлектриков						
2.1.6	Физика конденсирова:	ного состояния					
2.1.7	Физика магнитных яв.	пений					
2.1.8	Статистическая физик	a					
2.1.9	Физические свойства	кристаллов					
2.1.10	Методы математическ	ой физики					
2.1.11	Основы квантовой мех	каники					
2.1.12	Практическая кристал	лография					
2.1.13	Учебная практика по	получению первичных профессиональных умений					
2.1.14		получению первичных профессиональных умений					
2.1.15	Физика						
2.1.16	Физическая химия						
2.1.17	Электротехника						
2.1.18	Математика						
2.1.19	Органическая химия						
2.1.20	Информатика						
2.1.21	Химия						
2.1.22	Инженерная и компью	отерная графика					
2.2	Дисциплины (модули предшествующее:	и) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как					
2.2.1	Вакуумная и плазменн	пая электроника					
2.2.2	Квантоворазмерные ст	руктуры в наноэлектронике					
2.2.3	Магнитные измерения						
2.2.4	Математические моде	ли технологических процессов получения магнитоэлектроники и радиокерамики					
2.2.5	Моделирование техно	погических процессов получения материалов электронной техники					
2.2.6	Оборудование производства ферритовых материалов и радиокерамики						
2.2.7	Основы технологии электронной компонентной базы						
2.2.8	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы						
2.2.9	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы						
2.2.10	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы						
2.2.11	Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы						
2.2.12	Приборы квантовой и	оптической электроники					
2.2.13	Процессы вакуумной г	и плазменной электроники					
2.2.14	Светоизлучающие по	тупроводниковые приборы					
2.2.15	Технология производо	тва ферритовых материалов и радиокерамики					

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, COOTHECEHHЫЕ С ФОРМИРУЕМЫМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

ПК-3: Способность проводить предварительные измерения опытных образцов изделий электронной техники

Знать:

ПК-3-31 Методики измерения полупроводниковых фотоприемников

ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

Знать:

ОПК-1-31 Фундаментальные основы фотоэффектов в полупроводниках

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, умение анализировать процессы и системы с использованием соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов, применять системный подход для решения поставленных задач

Знать:

УК-1-31 Возможности современных источников, баз данных по архитектурам и функционалу фотоприемников

ПК-3: Способность проводить предварительные измерения опытных образцов изделий электронной техники

Уметь:

ПК-3-У1 Рабоать с современной аналитической аппаратурой

ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

Уметь:

ОПК-1-У1 Анализировать приборные, входные и выходные хараткеристики полупроводниковых фотопреобразователей.

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, умение анализировать процессы и системы с использованием соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов, применять системный подход для решения поставленных задач

Уметь:

УК-1-У1 Вычислять спектральные и электрические характеристик фотоприемников

ПК-3: Способность проводить предварительные измерения опытных образцов изделий электронной техники

Влалеть

ПК-3-В1 Навыками в современных програмынх средах характеризации полупроводниковых фотоприемников

ОПК-1: Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для решения задач инженерной деятельности

Влалеть:

ОПК-1-В1 Современными программными инструментами моделирования работы фотоприемников

УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, умение анализировать процессы и системы с использованием соответствующих аналитических, вычислительных и экспериментальных методов, применять системный подход для решения поставленных задач

Владеть:

УК-1-В1 Навыками проктирования фотоприемников заданного назначения

	4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ							
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Формируемые индикаторы компетенций	Литература и эл. ресурсы	Примечание	КМ	Выполн яемые работы
	Раздел 1. Фотоэффекты в полупроводниках							
1.1	Оптические явления в полупроводниках. Часть 1 /Лек/	7	1	ОПК-1-31	Л1.4 Л1.1 Л1.1Л3.7 Л3.9 Л3.10 Э1		KM1	P1,P2
1.2	Функционал фотоприемников различных архитектур /Ср/	7	2	ОПК-1-У1	Л1.1 Л1.4 Л1.1 Л1.6		KM1	P1,P2
1.3	Подготовка к расчетной части курсовой работы (Анализ спектров внешней квантовой эффективности). /Ср/	7	3	ОПК-1-В1	Л1.5		KM1	P2

1.4	Ознакомление с актуальной научной литературой, поисковыми сервисами и методическими материалами. /Ср/	7	3	УК-1-В1 ПК-3 -31 ПК-3-У1 ПК-3-В1	Л1.2 Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.3 Л1.7Л3.10 Л3.12 Э1 Э3	KM1	P2
1.5	Измерение спектров поглощения. Часть 1 /Лаб/	7	1	ОПК-1-31	Л1.1Л1.1 Э2	KM1	P2
1.6	Оптические явления в полупроводниках. Часть 2 /Лек/	7	1	ОПК-1-В1	Л1.2Л1.1 Э4	KM1	P1
1.7	Оптические явления в полупроводниках. Часть 3 /Лек/	7	1	ОПК-1-В1		KM1	P1
1.8	Измерения спектров поглощения. Часть 2 /Лаб/	7	1	УК-1-31 ОПК- 1-31 ОПК-1- У1 ОПК-1-В1		KM1	P2,P1
	Раздел 2. Фотоприемники на кристаллических полупроводниках						
2.1	Фотодиоды и фотопроводимость. Часть 1. /Лек/	7	1	ОПК-1-31	Л1.3 Л1.1 Л1.1 Л1.6 Л1.1Л2.1 Л1.1		
2.2	Пиксельные фотоприемники /Cp/	7	5	УК-1-В1	Л1.1 Л1.5 Л1.7Л3.9 Л3.10		
2.3	Специфика работы ИК фотоприемников /Пр/	7	1	УК-1-У1	Л1.5Л3.9 Э1		
2.4	Шумовые явления в фотодиодах /Пр/	7	1	ПК-3-31	Л1.5Л3.9 Э2		
2.5	Лавинные эффекты в фотодиодах /Лек/	7	1	ОПК-1-В1	Л1.7Л2.1 Л1.1Л3.9 Э1 Э3		
2.6	Био совместимые фотоприемники /Ср/	7	4	ОПК-1-31	Л1.1 Э3		
2.7	Широкозонные фотоприемники /Пр/	7	1	ОПК-1-У1	Л1.6 Л1.7Л3.9 Э5		
2.8	Проработка методического материала для подготовки к контрольной работе. /Ср/	7	4	УК-1-31	Л1.5 Л1.7Л1.1Л3. 9	KM1	P1,P2
2.9	Матрицы фотодиодов и совмещение фото TFT матриц /Ср/	7	4	ОПК-1-31	Л1.7Л3.9 Э6		
2.10	Резонансые явления в приборных структурах фотоприемников /Ср/	7	4	ОПК-1-У1	Л1.1 Л1.6 Э6		
2.11	Детекторы рентгеновского диапазона /Пр/	7	1	ОПК-1-31	Л2.1 Л1.1		
2.12	Детекторы МэВ- ТэВ диапазона /Пр/	7	1	ПК-3-31			
2.13	Детектроры дальнего ИК диапазона /Пр/	7	1	ПК-3-У1			
2.14	СВЧ фотопреобразователи /Пр/	7	1	УК-1-31			
2.15	Расчет эквивалентной схемы ФД. Часть 1 /Пр/	7	1	ОПК-1-У1			
2.16	Расчет эквивалентной схемы ФД. Часть 2 /Пр/	7	1	ПК-3-У1			
2.17	Расчет эквивалентной схемы ФД. Часть 3 /Пр/	7	1	ОПК-1-В1			

2.18	Расчет эквивалентной схемы ФД. Часть 4 /Пр/	7	1	УК-1-31			
2.19	Расчет эквивалентной схемы ФД. Часть 5 /Пр/	7	1	ОПК-1-31			
2.20	Расчет эквивалентной схемы ФД. Часть 6 /Пр/	7	1	ПК-3-У1			
2.21	Расчет эквивалентной схемы ФД. Часть 7 /Пр/	7	1	ОПК-1-31			
2.22	Фотоумножение в полупроводниковых структурах. Часть 2 /Пр/	7	1	УК-1-31 ПК-3- В1	Л1.1		
2.23	Фотоумножение в полупроводниковых структурах. Часть 3 /Пр/	7	1	ОПК-1-У1		KM1	
2.24	Фотоумножение в полупроводниковых структурах. Часть 4 /Пр/	7	1	ПК-3-31		KM1	
	Раздел 3. Тонкопленочные						
3.1	фотоприемники	7	1	OTIV 1 V1	Л1.7Л3.6		
	Принципы работы фоторезисторов /Лек/		-	ОПК-1-У1	Э2 Э4		
3.2	Фотопроводимость в органических полупроводниках. Часть 1 /Лек/	7	1	ОПК-1-У1	Л1.7Л2.1 Л3.9Л1.1 Э1 Э3		
3.3	Фотопроводимость в органических полупроводниках. Часть 2 /Лек/	7	1	ПК-3-31	Л1.7Л1.1Л3. 13 Э4		
3.4	Получение объемного гетероперехода в тонких пленках /Лаб/	7	1	ПК-3-31	Л1.5 Э4		
3.5	Получение объемного гетероперехода в тонких пленках. Часть 2 /Лаб/	7	1	ПК-3-У1	Л1.5Л1.1 ЭЗ Э4		
3.6	Оптические явления в аморфных полупроводниках /Ср/	7	5	ПК-3-У1	Л1.5 Э3		
3.7	Мета-структуры полупроводниковых фотопреобразователей. /Ср/	7	4	ПК-3-У1	Л1.5 Э3		
3.8	Металло - органические полупроводники /Ср/	7	5	ПК-3-У1	Л1.5 Э4		
3.9	Оптические свойства галогенидных перовскитов. Часть 1 /Лаб/	7	1	ОПК-1-В1			
3.10	Оптические свойства галогенидных перовскитов. Часть 2 /Лаб/	7	1	ПК-3-В1			
3.11	Оптические свойства галогенидных перовскитов. Часть 3 /Лаб/	7	1	ОПК-1-У1			
3.12	Оптические свойства галогенидных перовскитов. Часть 4 /Лаб/	7	1	ПК-3-31			
3.13	Оптические свойства галогенидных перовскитов. Часть 5 /Лаб/	7	1	ОПК-1-31			
3.14	Оптические свойства галогенидных перовскитов. Часть 6 /Лаб/	7	1	ОПК-1-У1			
3.15	Органичские фототранзисторы. Часть 1 /Лаб/	7	1	УК-1-В1			

3.16	Органичские фототранзисторы. Часть 2 /Лаб/	7	1	ОПК-1-31			
3.17	Получение прозрачных проводящиъ оксидов. Часть 1 /Лаб/	7	1	ОПК-1-31			
3.18	Получение прозрачных проводящиъ оксидов. Часть 2 /Лаб/	7	1	УК-1-В1			
3.19	Принципы работы фотопреобразователей на основе галогенидных перовскитов. Часть 1. /Лек/	7	1	УК-1-В1			
3.20	Принципы работы фотопреобразователей на основе галогенидных перовскитов. Часть 2. /Лек/	7	1	ОПК-1-В1			
3.21	Принципы работы фотопреобразователей на основе галогенидных перовскитов. Часть 3. /Лек/	7	1	ПК-3-У1			
3.22	Принципы работы фотопреобразователей на органических полупроводниках. /Лек/	7	1	ОПК-1-31			
3.23	Пигментные оптические ячейки /Лек/	7	1	УК-1-31			
3.24	Пигментные оптические ячейки. Часть 2 /Лек/	7	1	УК-1-В1			
3.25	Пигментные оптические ячейки. Часть 3 /Лек/	7	1	ОПК-1-В1			
	Раздел 4. Нестандартные и нишевые применения фотопремников						
4.1	Солнечные батареи орбитального использования /Лек/	7	1	УК-1-31 ПК-3- 31 ПК-3-У1 ПК-3-В1	Л1.6 Л1.7Л2.2Л1. 1 Л3.11 Э1 Э2 Э3	KM1	P2
4.2	ПРинцип работы антиотражающих покрытий /Лаб/	7	1	ОПК-1-У1	Л1.1 Л1.5Л1.1 Э3	KM1	P1
4.3	ПРименение метаповерхностей для солнечных батарей /Ср/	7	7	ОПК-1-31	Л1.1 Л1.5Л1.1	KM1	P2
4.4	Панельные конструктукции для орбитального использования солнечных батарей /Ср/	7	7	УК-1-У1	Л1.1 Л1.5 Л3.12	KM1	P1
4.5	Температурные эффекты при эксплуатации солнечных батарей /Лаб/	7	1	ОПК-1-В1		KM1	P2
4.6	Эксплуатация солнечных батарей при расеянном свете /Лаб/	7	1	ОПК-1-31		KM1	P2
4.7	Каскадные структуры фотопреобразователей и взаимодействие полупроводниковых структур с концентрированным потоком фотонов. /Лек/	7	1	УК-1-У1 УК-1 -В1		KM1	P1

5.	5.1. Контрольные мероприятия (контрольная работа, тест, коллоквиум, экзамен и т.п), вопросы для самостоятельной подготовки				
Код КМ	Контрольное мероприятие	Проверяемые индикаторы компетенций	Вопросы для подготовки		
KM1	Тестирование с расчетом по курсу	ОПК-1-У1;ОПК-1- В1;ОПК-1-31	 Концепция объемного гетероперехода в органических солнечных элементах. Экситоны в органических солнечных элементах, их диссоциация и встроенное поле в устройстве. Генерация напряжения в открытом контуре в объемном гетеропереходе OPV. Слои переноса дырок и электронов в OPV, их критическая роль в работе устройства. Концепция структуры перовскитного р-i-n прибора. Разница между основными принципами работы в Si ячейке, OPV ячейке и перовскитовой ячейке. Амбиполярный транспорт в перовскитных пленках, подавленная рекомбинация, ловушки в перовскитных пленках. Гистерезис в перовскитых солнечных элементах, роль вакансий. Нестабильность перовскита - коэффициент устойчивости и процессы деградации. Концепция АВХЗ молекулы перовскита, оптоэлектронная настройка с различными стохиометрическими составами. Возможности пассивации поверхности перовскита. Оптимизация роста зерен перовскита при его изготовлении, общие сведения. 		
5.2. Переч	чень работ, выполняе	емых по дисциплине ((Курсовая работа, Курсовой проект, РГР, Реферат, ЛР, ПР и т.п.)		
Код работы	Название работы	Проверяемые индикаторы компетенций	Содержание работы		
P1	Контрольная работа 1		Анализ приборных характеристик фотодиодов		

P2	Курсовая работа	Часть 1
	"Расчет основных	
	параметров	Дано:
	солнечного	
	элемента"	Данные ВАХ солнечного элемента, снятые при спектре 1.5 AM G,
		мощности падающего излучения ххх мВт/см2. Площадь
		солнечного элемента.
		Требуется:
		1. Построить ВАХ.
		2. Определить основные выходные параметры: Јкз, Uxx, ФФ, КПД,
		Rs, Rsh.
		3. Описать принцип работы солнечного элемента.
		4. Построить эквивалентную цепь солнечного элемента с указание
		расчетных сопротивлений.
		Методические указания
		1. Изучить различные типы принцип работы солнечного
		элементы и уравнение фототока. Описывающего ВАХ.
		2. Нарисовать эквивалентную схему фотопреобразователя с
		пояснением назначение ее эле-ментов.
		3. На графике выходных характеристик построить линию
		мощности с указание точки максимального значения
		4. Рассчитать шунтирующее и последовательное сопротивление в окрестностях Јѕс и Uxx U2-U1 / I1-I2 =R, т.е.
		рассчитать тангенс угла наклона касательной к характеристике на
		линейных участках.
		internal y terrea.
		ЧАСТЬ 2
		Дано: Спектр внешней квантовой эффективности
		фотопреобразователя, снятый при излучении света спектром (в
		заметках указано).
		Рассчитать: ширину запрещенной зоны фотоглощающего
		материала и плотность тока короткого замыкания.
	5.2. Outonous vo us	
n	5.5. Оценочные материаль	ы, используемые для экзамена (описание билетов, тестов и т.п.)

Экзамен по данной дисциплине не предусмотрен

5.4. Методика оценки освоения дисциплины (модуля, практики. НИР)

По дисциплине предполагается следующая шкала оценок:

- а) «отлично» студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает допол-нительно рекомендованную литературу;
- б) «хорошо» студент показывает твердые и достаточно полные знания в объеме пройденной программы, допускает незначительные ошибки при освещении за-данных вопросов, правильно действует по применению знаний на практике, чет -ко излагает материал;
- в) «удовлетворительно» студент показывает знания в объеме пройденной про-граммы, ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов, правильно действует по применению знаний на практике;
- Γ) «неудовлетворительно» студент допускает грубые ошибки в ответе, не понима-ет сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 6.1. Рекомендуемая литература 6.1.1. Основная литература Издательство, год Авторы, составители Заглавие Библиотека Л1.1 Туркулец В. И., Фотодиоды и фототриоды Электронная библиотека Москва, Ленинград: Удалов Н. П., Государственное Тищенко Н. М. энергетическое издательство, 1962

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л1.2	Соболева Н. А., Берковский А. Г., Чечик Н. О., Елисеев Р. Е., Зернов Д. В.	Фотоэлектронные приборы: монография	Электронная библиотека	Москва: Наука, 1965
Л1.3	Горелик С. С., Дашевский М. Я.	Материаловедение полупроводников и диэлектриков: учебник для студ. вузов по напр. 'Материаловедение и технология новых материалов', 'Материаловедение, технологии материалов и покрытий'	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2003
Л1.4	Бублик В. Т., Дубровина А. Н.	Методы исследования структуры полупроводников и металлов: учеб. пособие для вузов по спец Технология спец. материалов электрон. техники	Библиотека МИСиС	М.: Металлургия, 1978
Л1.5	Бонч-Бруевич В. Л., Звягин И. П., Карпенко И. В., Миронов А. Г.	Сборник задач по физике полупроводников: учеб. пособие для физ. спец. вузов	Библиотека МИСиС	М.: Наука, 1987
Л1.6	Киреев П. С.	Физика полупроводников: учеб. пособие для студ. вузов	Библиотека МИСиС	М.: Высш. шк., 1969
Л1.7	Горбачев В. В., Спицына Л. Г.	Физика полупроводников и металлов: учебник для вузов по спец. 'Технология спец. материалов электрон. техники'	Библиотека МИСиС	М.: Металлургия, 1982
	1	6.1.2. Дополните.	пьная литература	
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л2.1	Неменов Л. М., Наследов Д. Н.	Твердые выпрямители и фотоэлементы: монография	Электронная библиотека	Ленинград, Москва: Государственное издательство технико- теоретической литературы, 1933
Л2.2	Кузнецов Г. Д., Сушков В. П., Ованесов А. Е.	Определение параметров гетероструктур, используемых в оптоэлектронике: Лаб. практикум для студ. направления 550700 и спец. 654100	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 2002
Л2.3	Ковалев А. Н.	Транзисторы на основе полупроводниковых гетероструктур: монография	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2011
		6.1.3. Методиче	ские разработки	
	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л3.1	Тумерман Л. А.	Фотоэлемент и его применения	Электронная библиотека	Москва, Ленинград: ОНТИ НКТП ССС□, 1934
Л3.2	Клементьев С. Д., Карусь А. П.	Фотоэлектроника и ее применение: научно-популярное издание	Электронная библиотека	Москва: Военное издательство Министерства Обороны Союза СС□, 1954
Л3.3	Рывкин С. М., Жданов Г. С.	Фотоэлектрические явления в полупроводниках: монография	Электронная библиотека	Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1963

	Авторы, составители	Заглавие	Библиотека	Издательство, год
Л3.4	Павлов Л. П.	Методы определения основных параметров полупроводниковых материалов: учеб. пособие для студ. вузов спец. 'Полупроводниковые приборы'	Библиотека МИСиС	М.: Высш. шк., 1975
Л3.5	Юрчук С. Ю., Диденко С. И., Кольцов Г. И., Мартынов В. Н.	Полупроводниковые оптоэлектронные приборы: Курс лекций	Электронная библиотека	М.: Учеба, 2004
Л3.6	Мартынов В. Н., Спицына Л. Г.	Физика твердого тела: Разд.: Оптические и фотоэлектрические явления в полупроводниках: Лаб. практикум для студ. спец. 2001, 2002, 0710 и направл. 5507, 5516, 5531	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 2000
Л3.7	Полистанский Ю. Г., Александрова Е. А.	Физическая химия и технология полупроводниковых материалов и элементов микроэлектроники: Метод. пособие по курсовому и дипломному проектированию для студ. спец. 0643, 0604	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1986
Л3.8	Мартынов В. Н., Кольцов Г. И.	Полупроводниковая оптоэлектроника: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направл. 'Электроника и микроэлектроника' и спец. 'Микроэлектроника и полупроводниковые приборы'	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 1999
Л3.9	Спицина Л. Г.	Физика полупроводников и диэлектриков: метод. указания к выполнению дом. заданий и курсовых работ для студ. спец. 20.02	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 1989
Л3.10	Кожитов Л. В., Крапухин В. В., Улыбин В. А.	Технология эпитаксиальных слоев и гетерокомпозиций: Учебно-метод. пособие для студ. спец. 200100	Библиотека МИСиС	М.: Учеба, 2001
Л3.11	Ковалев А. Н.	Гетероструктурная наноэлектроника: учеб. пособие	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2009
Л3.12	Мурашев В. Н., Леготин С. А., Корольченко А. С., Орлова М. Н.	Физика фотопреобразователей: курс лекций	Библиотека МИСиС	М.: Изд-во МИСиС, 2011
Л3.13	Ковалев А. Н., Рабинович О. И., Тимошина М. И.	Физика и технология наноструктурных гетерокомпозиций: учебник	Электронная библиотека	М.: Изд-во МИСиС, 2015
				-
31	пособие / Ю.Н. Пархом	риборов фотоники : и нанотехнологии : учеб. иенко, А.А. Полисан М. : 3 142 c ISBN 978-5-	https://www.studentlibrary.ru/boo	k/ISBN9785876237071.html

Э2	Мурашев, С.А. Леготин, Корольченко А.С., М.Н. Орлова М.: Изд. Дом МИСиС, 2011 137 с.					
Э3	Physics of Solar Cells: From Basic Principles to Advanced Concepts . Wiley Physics of Solar Cells: From Basic Principles to Advanced Concepts, 3rd Edition, Peter Würfel , Uli Würfel ISBN: 978-3-527- 41309-6, Jun 2016 288 pages.	https://www.wiley-vch.de/en/areas-interest/natural-sciences/physics-11ph/solid-state-physics-11ph6/physics-of-solar-cells-978-3-527-41312-6				
Э4	Solar Cells and Light Management Materials, Strategies and Sustainability 2020, Pages 163-228 https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102762-2.00005-7	https://www.sciencedirect.com/book/9780081027622/solar-cells-and-light-management				
Э5	Silicon photomultipliers (SiPM), Photodetectors Materials, Devices and Applications 2016, Pages 255-294 https://doi.org/10.1016/B978-1-78242-445-1.00008-7	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978178242445 1000087				
Э6	Joe C. Campbell, Recent Advances in Avalanche Photodiodes, March 2006Journal of Lightwave Technology 34(2), DOI: 10.1109/OFC.2006.215989	https://ieeexplore.ieee.org/document/1637020				
	6.3 Перечень прог	раммного обеспечения				
П.1	Microsoft Office					
П.2	LMS Canvas					
П.3	Adobe Connect					
П.4	MATCAD					
П.5	MATLAB					
П.6	Microsoft Excel					
	6.4. Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных					
И.1	https://lms.misis.ru - Электронный образовательный ресурс «НИТУ МИСиС» Canvas.					

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ				
Ауд.	Назначение	Оснащение		
K-506	Лаборатория	автоматизированный лабораторный стенд п/п приборов в комплекте (Agilent3420A, Textronix AFG3252, Keithley 2401, Textronix TDS3054C); осциллограф С1-93; измеритель параметров пп Л2-56; вольтметр В7-77; вольтметр GDM-8145; междисциплинарная лабораторная платформа с комплектом ПО NI ELVIS II+ (3 шт.); учебные платы "Цифровые элементы информационно-измерительной техники" (5 шт.); платы по изучению и программированию микроконтроллеров NI Frescale (5шт.); плата "Основы цифровой техники и программирования ПЛИС" (5 шт.); учебный комплекс по технологии изготовления печатных плат; ПК; пакет лицензионных программ MS Office, компьютеры с ПО для проведения лабораторных работ (4 шт.)		
K-506	Лаборатория	автоматизированный лабораторный стенд п/п приборов в комплекте (Agilent3420A, Textronix AFG3252, Keithley 2401, Textronix TDS3054C); осциллограф С1-93; измеритель параметров пп Л2-56; вольтметр В7-77; вольтметр GDM-8145; междисциплинарная лабораторная платформа с комплектом ПО NI ELVIS II+ (3 шт.); учебные платы "Цифровые элементы информационно-измерительной техники" (5 шт.); платы по изучению и программированию микроконтроллеров NI Frescale (5шт.); плата "Основы цифровой техники и программирования ПЛИС" (5 шт.); учебный комплекс по технологии изготовления печатных плат; ПК; пакет лицензионных программ МS Office, компьютеры с ПО для проведения лабораторных работ (4 шт.)		

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Дисциплина относится к точным наукам и требует значительного объема самостоя-тельной работы. Отдельные учебные вопросы выносятся на самостоятельную проработку и контролируются посредством текущей аттестации. При этом

организуются групповые и индивидуальные консультации. Качественное освоение дисциплины возможно только при систематической самостоятельной работе, что поддерживается системой текущей и рубежной аттестации. Расчетнографические работы выполняются с помощью компьютерных программ: Microsoft Excel; MathCad, MATLAB, Electronics Workbench (MultiSim); Micro-Cap (microcap).